

致各位：

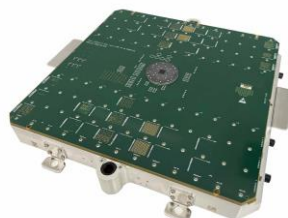
公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表者 董事长 山崎 秀和
所在地 京都府向日市森本町东之口 1-1
Nidec Park C 栋

尼得科精密检测科技参展 PCIM Expo & Conference 2025

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参展 2025 年 5 月 6 日（星期二）～ 5 月 8 日（星期四）在德国纽伦堡市举办的“PCIM Expo & Conference 2025”。



AC/DC Capacitance tester



Probe Card



NATS-1000

在本次展会上，电力电子行业将汇聚一堂，旨在跨越国界共同探索最新的研发趋势，整个行业共同分享创意，提供解决方案。

本公司在本次展会上将展示从芯片（Chip）级到系统级面向功率器件的先端检测系统。此外，还将现场实际演示有助于缩短研发周期的 HILS（Hardware-In-the-Loop Simulation）平台。

今后，本公司将继续以行业先端的测量和检测技术为全球制造业做出贡献。

〈参展概要〉

- ・展期：2025 年 5 月 6 日（星期二）～ 5 月 8 日（星期四）
- ・展馆：德国纽伦堡市 NürnbergMesse 展览中心
- ・展位：4-432
- ・官网：<https://pcim.mesago.com/events/en.html>

〈参展内容〉

- ・用于 IGBT/SiC 功率模块的绝缘/静态特性/动态特性检测装置“NATS-1000/1700 系列”
- ・SiC 模块可靠性测试装置“NATS-8000 系列”
- ・电机测试台用逆变器&POWER HIL 电机模拟器“R-1100”
- ・运用 AI 技术的 xEV 建模模拟器“E-Transport Simulator®”
- ・AC/DC 电容测量用多功能测试仪“R-700 系列”
- ・半导体器件稳定测量探针“TC-Probe”
- ・适用于高电压的加压结构探针卡“Chamber head Probe Card”
- ・适用于高温/高电流的探针“3H+ Probe”